

2012年度 ソフトウェア工学講演会

ソフトウェアの試験技術で著名な業績を挙げ、特にメタモルフィック試験の提唱者として知られるChen教授による講演会を開催します。多数の教員、学生の皆様の参加をお待ちしています。

題名: テスト不可能なプログラムのテスト技術: メタモルフィックテスト技術

**講師: Y. T. Chen (Professor, Software Engineering,
Swinburne University of Technology, Australia)**

日程: 2012年11月13日(火) 15:45-17:15 (4限)

会場: G204教室



概要

ソフトウェアテストの重要な課題としてプログラムの計算結果の正しさの確認がある。例えば、データベースやインターネットの検索を利用した時に検索結果の正しさをどのように確認するか？ 天気予報の正しさを確認できるか？もし、このようなプログラムの計算結果の正しさを確認できなければ、どうしてテストができるのだろうか？このようなプログラムは一般に「テスト不可能なプログラム」と呼ばれる。この講演ではテスト不可能なプログラムをテストする簡潔なアプローチである「メタモルフィックテスト」を紹介する。さらに、メタモルフィックテストの概念を他のテストや分析技術と統合して、応用範囲を拡張できることを示す。広く利用されているプログラムスライスとの統合についても紹介する。

文責: 青山 幹雄